

受託試験料金表

機器名等 (メーカー名及び型番)	項目	試験単位等	料金(円) (消費税及び地方消費税を除く。)
超高温キセノン四稜円鏡型 単結晶製造装置 (Crystal Systems FZ-T-12000-X-VPO-PC-YH)	単結晶サンプル育成 (原料セラミックス棒をユーザーが 準備)	1検体 (8時間以内)	49,400
	単結晶サンプル育成及び 原料セラミックス棒作製	1検体 (8時間以内)	別途相談
ナノ秒レーザー加工装置 (Oxford Lasers Micromachining System A-series OFLS-532-10-A)	通常加工 (加工条件確定のためのテスト加工を 含む。)	被加工物 16 個以内 (8時間以内)	52,000
300kV透過電子顕微鏡(300kV-TEM) (JEOL JEM-3100FEF)	通常観察	1検体 (4時間以内)	300,000
	クライオサンプル観察	1検体 (4時間以内)	396,000
走査透過電子顕微鏡(STEM) (HITACHI HD-2700)	通常観察・EDX元素分析・EELS分 析・ナノビーム電子回折図形	1検体 (4時間以内)	374,000
超高分解能電界放出型電子顕微鏡 (FE-SEM) (HITACHI SU9000)	通常観察・EDX元素分析	1検体 (4時間以内)	109,600
	コーティングの追加	1検体	5,000
低真空分析走査電子顕微鏡 (HITACHI SU6600)	通常観察・EDX元素分析・EBSD分析	1検体 (4時間以内)	77,400
	コーティングの追加	1検体	5,000
多機能分析走査電子顕微鏡 (JEOL JSM-IT800(SHL))	通常観察・EDX元素分析・EBSD分 析・CL分析	1検体 (4時間以内)	120,000
	コーティングの追加	1検体	5,000
微小デバイス特性評価装置 (nanoEBAC) (HITACHI NE4000)	通常観察	1検体 (4時間以内)	540,000
表面ダイナミクス解析原子間力顕微 鏡装置 (Bruker NanoWizard ULTRA Speed 2)	通常観察	1検体 (4時間以内)	93,000
走査プローブ顕微鏡(SPM) (HITACHI SPA400)	通常観察	1検体 (2時間以内)	21,200
二重収束型質量分析計(Sector) (JEOL JMS-700 MStation)	通常分析	1検体 (1時間以内)(※1)	16,000
	GC利用	1検体 (立ち上げを含む。)(※1)	80,000
		1検体 (上段同様試料で2検体目以降)(※1)	32,000
マトリックス支援レーザーイオン化 飛行時間型質量分析計(MALDI-TOF- MS) (Bruker autoflex II)	通常分析	1検体(1時間以内)(※1) (指定されたマトリックス1種を分析)	9,400
	マトリックスの追加	1マトリックス	2,400

マトリックス支援レーザーイオン化 Spiral飛行時間型質量分析計 (MALDI-Spiral-TOF-MS) (JEOL JMS-S3000)	通常分析	1検体(1時間以内)(※1) (指定されたマトリックス1種を分析)	14,400
	マトリックスの追加	1マトリックス	2,400
LC/TOFMS飛行時間型質量分析計 (LC/TOF-MS) (JEOL JMS-T100LC AccuTOF)	通常分析	1検体 (1時間以内)(※1)	14,800
	カラム利用(LC条件提示あり) (※2)	1検体 (立ち上げを含む。)(※1)	103,600
		1検体 (上段同様試料で2検体目以降)(※1)	29,600
	カラム利用(LC条件提示なし) (※2)	1検体 (立ち上げ、条件検討を含む。)(※1)	162,800
1検体 (上段同様試料で2検体目以降)(※1)		44,400	
LC-TOFMS 高分解能飛行時間型質量 分析計 (JEOL AccuTOF LC-plus 4G, DART/ESI/CSI/APCI)	通常分析	1検体 (1時間以内)(※1)	14,800
	カラム利用(LC条件提示あり) (※2)	1検体 (立ち上げを含む。)(※1)	103,600
		1検体 (上段同様試料で2検体目以降)(※1)	44,400
	カラム利用(LC条件提示なし) (※2)	1検体 (立ち上げ、条件検討を含む。)(※1)	162,800
		1検体 (上段同様試料で2検体目以降)(※1)	44,400
	CSI測定	1検体(※1)	29,600
		1検体 (上段同様試料で2検体目以降)(※1)	14,800
X線構造解析装置 (Rigaku SmartLab9kW/IP/HY/N)	通常分析	1検体 (4時間以内)	40,000
微小単結晶X線構造解析装置 (Rigaku VariMax RAPID RA-Micro7)	通常分析	1検体 (20時間以内)	218,000
600MHzNMR(※3) (JEOL JNM-ECA600)	通常分析	1検体(1H:30分以内) (その他(13C等)の場合、1検体の測定時間は3時間 以内で、料金は右記の6倍とする。)	10,400
500MHzNMR(※3) (JEOL JNM-ECXZ500R)	通常分析	1検体(1H:30分以内) (その他(13C等)の場合、1検体の測定時間は3時間 以内で、料金は右記の6倍とする。1測定あたり3時 間以内とする。)	7,800
400MHz 固体・溶液NMR(※3) (JEOL JNM-ECX400P)	通常分析		7,800
電子スピン共鳴装置(ESR) (JEOL JES-FA100N)	通常分析	1検体 (4時間以内)	19,200
電子線マイクロアナライザ(EPMA) (SHIMADZU EPMA1610)	通常分析	1検体 (4時間以内)	120,000
多機能走査型X線光電子分光分析装 置(XPS) (ULVAC-PHI PHI 5000 VersaProbe II)	通常分析	1検体 (8時間以内)	102,600
顕微レーザーラマン分光光度計 (JASCO NRS-4100)	通常分析	1検体 (4時間以内)	30,000
円二色性分散計(CD) (JASCO J-820)	通常分析	1検体 (3時間以内)	27,000

ダイナミック光散乱光度計 (Otsuka Electronics DLS-6000)	通常分析	1検体 (6時間以内)	50,400
分光エリプソメーター (HORIBA JOBIN YVON UVISEL ER AGMS-NSD)	通常分析	1検体 (2時間以内)	44,400
光ダイナミクス分光装置(※4) (Coherent Mira 900) (USHO KEC- 160) (HAMAMATSU C10910-04)	通常分析	1検体 (8時間以内)	110,400
全自動元素分析装置 (PerkinElmer 2400 II CHNS/O)	通常分析	1検体 (30分以内)	5,600
示差走査熱量計・示差熱重量同時 測定装置 (HITACHI DSC 7000X/ STA 7200)	通常分析	1検体 (4時間以内)	36,000
熱/電気物性評価装置(物性評価装 置: PPMS) (Quantum Design PPMS EverCool II)	通常分析	1検体 (8時間以内)	65,400
大気中光電子分光装置 (RIKEN KEIKI AC-3)	通常分析	1検体 (1時間以内)	17,800
分光感度・内部量子効率測定装置 (BUNKOUKEIKI CEP-2000RP)	通常分析	1検体 (2時間以内)	30,000

(※1) 1検体では、ポジティブモード又はネガティブモードのどちらか1モードでの測定となる。

(※1) 両モードの測定を希望する場合は、2検体となる。

(※2) 本学のカラムを利用する場合は、1検体あたり1,000円(消費税及び地方消費税を除く。)の追加料金が発生する。

(※2) また、本学で移動相を準備する場合は、1検体あたり500円(消費税及び地方消費税を除く。)の追加料金が発生する。

(※3) 溶液試料測定に用いる重水素化溶媒は、依頼者が用意する。

(※4) 利用機器の使用数にかかわらず、1検体あたりの料金とする。

・受託試験料金表に定めるもののほか、標準測定時間を超過する場合や、特別な観察又は分析に必要な処理を行う場合は、別途実費相当額を徴収することがある。